



# ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.

Δρ Κ.Ι. ΒΑΜΒΑΚΑΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΘΗΝΑ**  
SPM SCANNING PROBE MICROSCOPY & AFM ATOMIC FORCE MICROSCOPE  
**VEECO**  
**Τρίτη 8 Μαΐου 2007**

Η Εταιρεία VEECO – πρωτοπόρος στη Μετρολογία – συνεχίζει να πρωτοστατεί στην ανάπτυξη σύγχρονων τεχνικών και νέων εφαρμογών. Στα πλαίσια αυτά η Εταιρεία μας, σε συνεργασία με τον οίκο Veeco, έχει την τιμή να σας προσκαλέσει την Τρίτη 8 Μαΐου 2007 και ώρα 08:30 στην αίθουσα Σεμιναρίων της Εταιρείας μας, οδός Τζαβέλλα 9, Κ. Χαλάνδρι για τις νεώτερες εξελίξεις στον τομέα της **Μικροσκοπίας Σάρωσης Ακίδας (SPM)** & **Μικροσκοπίας Ατομικής Δύναμης (AFM)**.

Οι ομιλίες θα δοθούν από τον ειδικό επιστήμονα Dr. Hartmut Stadler.

08.30-09.00 *Προσέλευση – Καφές- Αναψυκτικά*

09:00-09:05 Welcome to the Seminar

Δ. Σταμέλος

09:05-09:15 Veeco Introduction

Dr. H. Stadler

09:15-10:15 NanoScope Characterization Techniques

Dr. H. Stadler

10:15-10.30 *Διάλειμμα - Καφές - Αναψυκτικά*

10:30-11:45 Advance in SPM Instrumentation

Dr. H. Stadler

11:45-12:00 SPM/AFM Applications (Part 1)

Dr. H. Stadler

12:00-12:30 *Ελαφρύ γεύμα*

12:30-13:30 SPM/AFM Applications (Part 2)

Dr. H. Stadler

13:30:14:30 Questions

Θα δοθεί *Βεβαίωση Συμμετοχής* σε όσους παρακολουθήσουν το Σεμινάριο Μετρολογίας VEECO.

Παρακαλούμε επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας μέχρι το αργότερο Παρασκευή 4 Μαΐου 2007, στην κα Ράνια Γεωργίου, τηλ. 210 6748 973 ή fax 210 6748 978, ή e-mail [r.georgiou@analytical.gr](mailto:r.georgiou@analytical.gr)

Με εκτίμηση,  
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕ

Δ. Σταμέλος  
Χημικός  
Δ/ντής Πωλήσεων Veeco

[Διαγωνίως απέναντι, οδός Τζαβέλλα 11, υπάρχει δωρεάν υπαίθριος χώρος στάθμευσης]